

=1.5 mA/a. e. m., т. е. при работе в диапазоне массовых чисел 1—1000 а. е. м. максимальное значение токов, пропускаемых через стержни, соответствует 1.5 А.

Пропускание такой величины тока через стержни анализатора технически реализуемо.

Из (14) следует, что при наличии магнитного поля, величина разрешающей способности квадрупольного фильтра масс изменяется как за счет энергии ионов, так и величины тока. В случае, когда на электроды подается постоянная составляющая напряжения, доля ее величины от переменной составляющей  $\lambda = U/V \leq a_0/2q_0 = 2.5 \cdot 10^{-5}$  очень мала, поэтому поддержание величины  $\lambda$  со стабильностью  $< 10^{-3}$  представляет техническую трудность.

Возможность сепарации ионов с энергиями в сотни электронвольт обусловлена чрезвычайной узостью ( $q_0/\Delta q = 5000$ ) по оси  $q$  III области стабильности.

Влияние магнитного поля небольшой величины на траектории ионов в третьей области стабильности существенно вследствие большой величины отношения параметров  $q_0/a_0$ , а также из-за больших значений энергий ионов.

### Выводы

1. Предложен способ формирования магнитного поля в квадрупольном фильтре масс, величина которого линейно растет с координатой. Показана возможность использования плоского магнитного поля в режиме работы в III области стабильности параметров  $a, q$  уравнения Маттье. Получено, что требуемое значение тока на 1 а. е. м. массы иона составляет единицы миллиампер.

2. Сепарация ионов по массам в режиме работы III области стабильности критична к внешним магнитным полям.

### Литература

- [1] Dawson P. H., Yn. Bingo // Int. J. Mass. Spectr. and Ion Phys. 1984. Vol. 56. P. 25—39.
- [2] Vehida Y., Miwa T., Hattori S. Mass. Spectr. 1982. Vol. 30. N 3. P. 219—226.
- [3] Dawson P. H., Bingo Yn. // Int. J. Mass. Spectr. and Ion Phys. 1984. Vol. 56. P. 41—50.
- [4] Чупахин М. С. Зондовые методы в искровой масс-спектрометрии. М.: Энергоатомиздат, 1985. 109 с.
- [5] Fetterolf D. P., Yost R. A. // Int. J. Mass. Spectr. and Ion Phys. 1982. Vol. 44. P. 37—50.

Поступило в Редакцию  
26 октября 1987 г.

В окончательной редакции  
2 марта 1988 г.

05; 06; 11

Журнал технической физики, т. 59, в. 1, 1989

## ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД СО СКАЧКОМ ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОХРОМИЗМЕ В ПЯТИОКСИСИ НИОБИЯ

В. В. Белозеров, Ю. И. Малюк, Л. И. Скатков

Исследованы особенности электрохромизма в поликристаллической пятиокиси ниобия ( $Nb_2O_5$ ). Полученные результаты позволяют интерпретировать электрохромный процесс в  $Nb_2O_5$  как совместное действие двух механизмов: а) инъекции в оксид электронов, заряд которых компенсируется внедрением в  $Nb_2O_5$  протонов и экстракцией из образца анионов кислорода, а также б) фазового перехода со скачком поглощения, инициируемом структурными искажениями в  $Nb_2O_5$  при разупорядочении в анионной подрешетке оксида.

Впервые электрохромный эффект (ЭХЭ) был исследован в пятиокиси ниобия [1], где рентгенодифрактометрическими методами была показана роль инъекции в оксид протонов из электролита, что позволило в дальнейшем [2] объяснить ряд особенностей электрохромизма в оксидах переходных металлов (ОПМ).

Предложенная модель, в общем удовлетворительно интерпретировавшая природу электрохромизма ОПМ, тем не менее оказалась противоречивой в отдельных деталях. В частности, не нашел объяснения факт отсутствия ЭХЭ в пленках  $Ta_2O_5$ , структура которого близка к структуре  $Nb_2O_5$  [3] и способна «принять» весьма значительное количество протонов при фотохромном эффекте [4]. Оценочный анализ количественных зависимостей указывает на

превышение степени поглощения над числом инжектированных в оксид электронов, хотя, естественно, квантовый выход поглощения не может быть больше единицы. При электроокрашивании выявилось также значительное смещение края собственного поглощения (КСП) оксида в коротковолновую область, которое трудно объяснить инжекцией протонов, так как оно является характерным признаком экстракции анионов кислорода, что имеет место, например, при электрохимическом восстановлении  $V_2O_5$  [5] и вакуумном отжиге препаратов  $Nb_2O_5$  (рис. 1).

В пользу возможности протекания наряду с двойной инжекцией протонов и электронов процесса экстракции анионов кислорода свидетельствует также выявленное нами обратимое изменение относительной интенсивности дифракционных максимумов (рис. 2), указывающее на разупорядочение в подрешетке кислорода  $Nb_2O_5$ , при сохранении неизменным типа кристаллической решетки.

Таким образом, представлялось целесообразным провести исследования и сопоставление различных аспектов электроокрашивания поликристаллических пленок  $Nb_2O_5$  при а) двойной инжекции протонов и электронов в водных растворах электролитов и б) экстракции кислорода через границу раздела электролит—поверхность оксида. Последнее стало возможным благодаря обнаруженной разновидности ЭХЭ, который протекает в расплаве кислородсодержащих солей при знакопеременной электрохимической поляризации оксидных слоев на проводящих подложках.

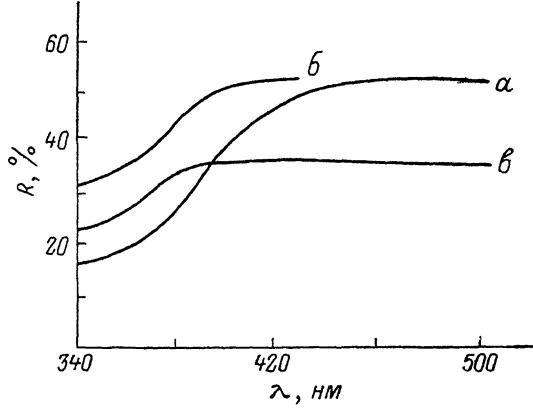


Рис. 1. Спектральные зависимости коэффициента отражения пленок  $Nb_2O_5$ .

а — неокрашенная пленка; б — пленка, окрашенная в водном электролите; в — пленка, восстановленная отжигом в вакууме.

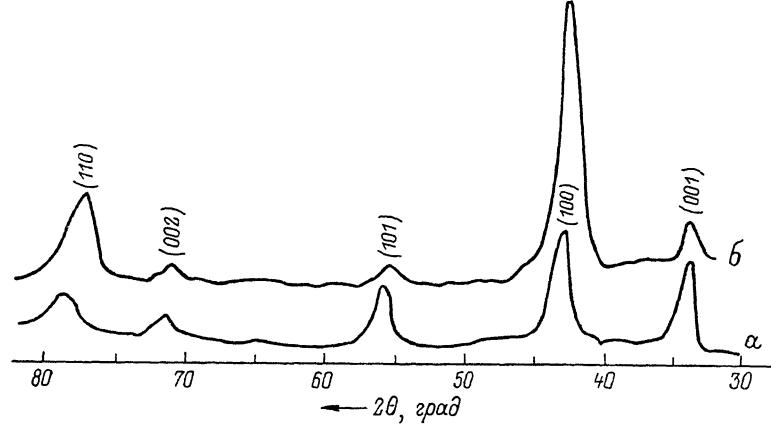


Рис. 2. Структурные изменения при электрохромном процессе в пленках  $Nb_2O_5$ .

а — неокрашенная пленка; б — пленка, окрашенная в водном электролите.

Такого рода сопоставление позволяет выделить из суммы эффектов, маскирующих друг друга при инжекции и экстракции, вероятно, имеющих место при электроокрашивании в водных электролитах, только те, что вносятся одной лишь экстракцией.

### Приготовление образцов и методика эксперимента

Пленки  $Nb_2O_5$  для исследований были получены анодированием технической ниобиевой жести в расплаве соли  $KNO_3$  при температуре рекристаллизации  $Nb_2O_5$  ( $T \approx 700$  К) в гальваностатическом режиме при  $d_a = 1$  А/см<sup>2</sup> до напряжения 25 В. Как показано в [6], образуемые таким образом поликристаллические слои представляют собой псевдогексагональную  $\alpha$ -модификацию  $Nb_2O_5$  с параметрами элементарной ячейки  $a = 3.607$  Å,  $c = 3.925$  Å. Рентгенострук-

турные исследования проводились на дифрактометре ДРОН-3 в фильтрованном излучении  $\lambda$ -Сr при точечной регистрации дифракционных отражений, измерения проводились по линиям (201) и (112). Электрохромное окрашивание — обесцвечивание осуществлялось в электролите анодирования при той же температуре.

Флуоресцентный рентгеновский анализ (ФРА) проводился на установке VRA по интенсивности  $K_{\alpha}$  линий рентгеновского флуоресцентного излучения образцов с вычетом фона. В качестве эталона калия использовался кристалл KCl.

Спектральные зависимости коэффициента отражения снимались на спектрофотометре СФ-4 с приставкой диффузного отражения ПДО-1.

### Результаты и их обсуждение

Ионообменными процессами на границе  $Nb_2O_5$ —расплав  $KNO_3$  могут являться: а) инжекция в оксид катионов  $K^+$ , б) экстракция из  $Nb_2O_5$  анионов кислорода, в) совместное действие а и б. Методом ФРА установлено, что в исходном и окрашенном состоянии содержание калия в образцах не меняется, что позволяет исключить из рассмотрения механизмы а и в.

Изменения дифракционной картины от пленок  $Nb_2O_5$  при электрохромном процессе в расплаве представлены на рис. 3. Сравнение рис. 2 и 3 показывает, что структурные изме-

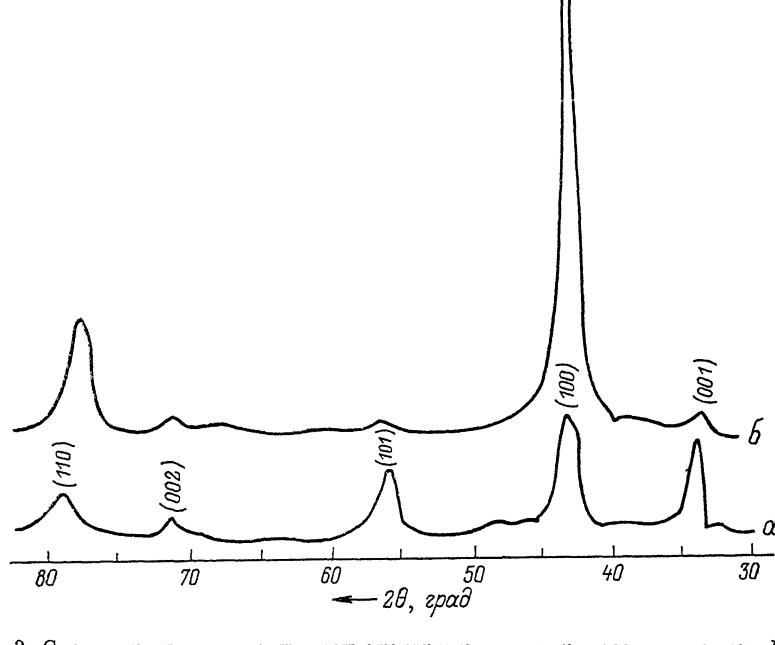


Рис. 3. Структурные изменения при электрохромном процессе в пленках  $Nb_2O_5$ .  
а — неокрашенная пленка; б — пленка, окрашенная в расплаве  $KNO_3$ .

нения, наблюдающиеся при электроокрашивании в расплаве и в водном электролите, качественно совпадают. Совпадает также характер сдвига КСП на начальной стадии электрохромного процесса, сопровождающейся значительным смещением в коротковолновую область при исчезающем малой степени окрашивания (рис. 4, б), тогда как дальнейший незначительный сдвиг КСП приводит к заметному изменению интенсивности окраски (рис. 4, в) с последующим переходом на конечной стадии в состояние (рис. 4, г), характеризующееся сужением ширины запрещенной зоны  $Nb_2O_5$  от 3.15 эВ до значений менее 1 эВ.

Последнее обстоятельство, указывающее на признаки фазового перехода 1-го рода, коррелируется с динамикой изменения объема элементарной ячейки  $Nb_2O_5$  (см. таблицу): на начальной стадии окрашивания объем элементарной ячейки возрастает (вследствие анизотропного изменения параметров  $a$  и  $c$ ), а затем при приближении к конечной стадии вновь уменьшается.

Из полученных экспериментальных данных можно предположить, что начальная стадия процесса в водном электролите связана с экстракцией анионов кислорода. Количество образующихся при этом F-центров недостаточно для окрашивания, тем не менее эта стадия явля-

ется как бы «спусковым механизмом» для всего процесса, так как делает возможным начало протекания двойной инжекции протонов и электронов, вносящей основной вклад в электрохромизм. Объясняется это тем, что, как сейчас признано и показано экспериментально в [1], процесс двойной инжекции при электрохромизме протекает по механизму хемосорбции. Экстракция анионов кислорода из поверхностных слоев оксида резко активизирует хемосорбционные свойства поверхности по классическому механизму адсорбции на F-центре [7]. Появление дефектов в анионной подрешетке  $Nb_2O_5$  приводит также к снижению энергии разупорядочения [8] и, как следствие, последовательному переходу структуры образца в разупорядоченное состояние. Возникающие при этом искажения в кристаллической решетке обусловливают на последних стадиях процесса сужение запрещенной зоны  $Nb_2O_5$  с резким изменением оптических и электрофизических свойств, сопровождающимся структурными изменениями в виде уменьшения объема элементарной ячейки, что является признаком фазового перехода 1-го рода — «широкозонный полупроводник—узкозонный полупроводник», который охватывается в терминологии фазовых переходов термином «фазовый переход металл—полупроводник».

В рамках предложенной модели находят удовлетворительное объяснение выявленные ранее противоречия в деталях электрохромного процесса, в частности, то что разные, с этой точки зрения, свойства оксидов ниobia и тантала. Как показано выше, эффективное протекание процесса окрашивания происходит при образовании в поверхностных слоях заряженных кислородных вакансий, что возможно при достаточно низкой энталпии образования их. Известно, что эта величина также определяет другое характеристическое свойство оксидов —

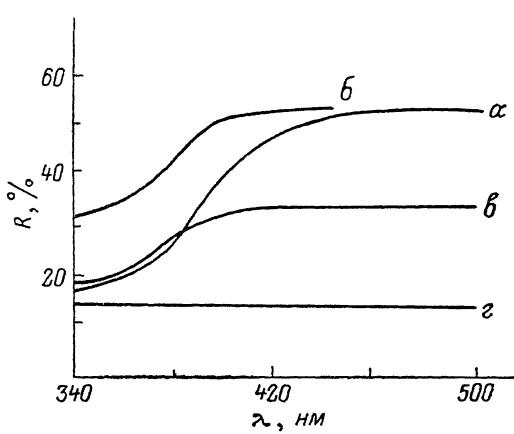


Рис. 4. Спектральные зависимости коэффициента отражения пленок  $Nb_2O_5$  (окрашивание в расплаве).

а — неокрашенная пленка, б — начальная стадия окрашивания, в — промежуточное окрашивание, г — конечная стадия окрашивания.

### Структурные изменения при электрохромизме в $Nb_2O_5$

Образец, параметры решетки	Исходное состояние	Начальная стадия окрашивания	Максимальное окрашивание
$a, \text{ \AA}$	3.6158	3.6254	3.6353
$c, \text{ \AA}$	3.9355	3.9198	3.8894
$c/a$	1.088	1.081	1.070
$V, \text{ \AA}^3$	44.53	44.64	44.57

наличие зоны гомогенности по кислороду [9]. В [2] показано, что электрохромным эффектом обладают только те оксиды металлов ( $Nb$ ,  $W$ ,  $Ti$ ,  $V$  и др.), которые имеют широкую зону гомогенности при комнатной температуре, оксиды металлов  $Ta$ ,  $Zr$ ,  $Al$  и др., не имеющие зоны гомогенности при комнатной температуре, электрохромных свойств не проявляют.

Изменение оптических свойств  $Nb_2O_5$  в виде скачка поглощения вследствие фазового перехода типа металл—полупроводник объясняет противоречие между количеством инжектированных в оксидный слой протонов и степенью поглощения.

В заключение следует подчеркнуть, что, хотя предложенная модель относится к поликристаллической  $Nb_2O_5$ , не вызывает сомнений тот факт, что в аморфных слоях, обладающих лучшими электрохромными свойствами, как это показано в [10], протекание электрохромного процесса происходит также по приведенной выше стадийной схеме. Подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки настоящего сообщения. Заметим лишь, что, как установлено авторами [11], отсутствие дальнего порядка в аморфной структуре ОПМ не запрещает в них фазовых переходов типа металл—полупроводник.

- [1] Палатник Л. С., Малюк Ю. И., Белозеров В. В. // ДАН СССР. 1974. Т. 215. № 5. С. 1182—1185.
- [2] Малюк Ю. И. Автореф. канд. дис. Воронеж, 1977. 16 с.
- [3] Шуберт К. Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз. М.: Металлургия, 1976. 531 с.
- [4] Гаврилюк А. И., Мансуров А. А., Чудновский Ф. А. // Тез. докл. Всес. конф. «Физика окисных пленок». Петрозаводск, 1982. С. 10.
- [5] Гаврилюк В. И., Черненко И. М. // Письма в ЖТФ. 1981. Т. 7. Вып. 17. С. 1041—1044.
- [6] Малюк Ю. И., Чернякова Л. Е. // УФЖ. 1973. Вып. 1. С. 45—49.
- [7] Волькенштейн Ф. Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при хемосорбции. М.: Наука, 1987. 265 с.
- [8] Крегер Ф. Химия несовершенных кристаллов. М.: Мир, 1969. 654 с.
- [9] Кофтад П. Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов. М.: Мир, 1975. 66 с.
- [10] Малюк Ю. И., Скатков Л. И. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. Вып. 8. С. 504—507.
- [11] Малиненко В. П., Стефанович Г. Б., Чудновский Ф. А. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. Вып. 12. С. 754—756.

Харьковский политехнический  
институт им. В. И. Ленина

Поступило в Редакцию  
26 октября 1987 г.

В окончательной редакции  
25 февраля 1988 г.

10; 12

Журнал технической физики, т. 59, в. 1, 1989

## МАСС-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА

В. Т. Коган, А. П. Корниенко, Б. В. Кошевенко,  
А. К. Павлов, Ю. В. Чичагов

При изучении солнечного ветра с помощью масс-спектрометрической техники предъявляются несколько необычные по сравнению с традиционными требованияния. Они заключаются в необходимости проведения масс-анализа в условиях быстрых изменений (0.1—10 с) в широком диапазоне скоростей (300—700 км/с) измеряемых потоков ионов при чувствительности  $10^{-3}$  ион  $\cdot$  с $^{-1}$   $\cdot$  см $^{-2}$ .

Выполнение этих требований с помощью известных приборов и методов анализа в рамках жестких ограничений на размеры и вес аппаратуры в космическом эксперименте не представляется возможным.

Для решения этой задачи предложен новый масс-спектрометр [1]. Целью настоящей работы является изучение его характеристик.

### 1. Ионно-оптическая схема

Анализ состава потока заряженных частиц осуществляется за счет их селекции в пространстве скоростей, а не координат, как в традиционных масс-спектрометрах.

Основным элементом схемы является магнитная система, обеспечивающая постоянное поле (рис. 1). Плоскость  $xz$  является средней плоскостью системы. Магнитное поле создается вытянутыми вдоль оси  $z$  полюсами для обеспечения двумерности поля в области прохождения заряженных частиц. В этой области поле не зависит от координаты  $z$ .

Обозначим угол между направлением скорости частицы и средней плоскостью через  $\psi$ , а угол между проекцией скорости на эту плоскость и осью  $x$  через  $\theta$  и пометим углы для частиц перед магнитом индексом 1, за магнитом — индексом 2. Для частиц, движущихся в средней плоскости  $\psi_1 = \psi_2 = 0$  в однородном поле магнита при отсутствии поля за его границами выполняется соотношение

$$\sin \theta_2 - \sin \theta_1 = \frac{N}{H_0 \rho_0} = \frac{h_0}{\rho_0},$$